L'Innovazione a portata di click

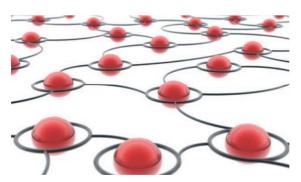
Giorgio Meneghin

Fondazione Centro Produttività Veneto – CPV

Patlib Vicenza







# Argomenti

- la ricerca di anteriorità brevettuale (standard): Limiti;
- Come superare i limiti della ricerca brevettuale con una Ricerca Brevettuale Semantica);
- Il servizio di Ricerche ad Alto Contenuto Tecnologico





# Le fasi della ricerca brevettuale standard:

- 1) L'azienda / utente propone una <u>soluzione</u> ad un <u>problema</u> di natura tecnica
- 2) Raccolta e selezione, da parte del personale Patlib, delle informazioni rilevanti dal punto di vista brevettuale
- 3) Svolgimento della ricerca su data base pubblici ("espacenet") e/o privati, con (eventuale) controllo su data base scientifici e/o tecnologici (letteratura non brevettuale)
- 4) Catalogazione dei risultati in formato lettera (Report)







# Le fasi della ricerca brevettuale standard:

Fase 3: Svolgimento della ricerca su data base pubblici ("espacenet") e/o privati

La ricerca su "espacenet" si svolge (solitamente) nel modo seguente:

- Identificazione delle parole chiave (Keywords);
- Ricerca preliminare con l'utilizzo di alcune Keywords
- Estrazione delle classificazioni IPC e/o CPC pertinenti;
- Ricerca approfondita combinando parole chiave e classificazioni brevettuali (o, se "esatte", con sole classificazioni)







# Le fasi della ricerca brevettuale standard:

Fase 4: Catalogazione dei risultati in formato lettera (Report)

Il report contiene:

- Criteri di ricerca utilizzati;
- Elenco dei documenti (brevetti e non) emersi;
- Specifiche dei principali documenti (sintesi in italiano);
- Report finale (Opinione scritta circa la possibilità di brevettazione)







• Il problema tecnico sottoposto deve presentare (almeno) una soluzione;

• L'utilizzo di alcune parole chiave può essere "fuorviante";

- Difficoltà o impossibilità, per determinate tipologie di ricerche, di individuare le classificazioni IPC / CPC corrette;
- Elaborazioni statistiche (in "espacenet") deficitarie







### **ESEMPIO 1**

Ricercare sistemi / metodi che consentono di allungare la durata (vita) dei semiconduttori

Ricerca in "espacenet"

Parole chiave: IMPROVE, LIFE, DURATION, SEMICONDUCTORS

# Advanced search Select the collection you want to search in i Worldwide - collection of published applications from 90+ countries Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in Enter keywords in English Title: i plastic and bicycle Title or abstract: i hair IMPROV\* (LIF\* OR DURATION\*) SEMICONDUCT\*







Si ottengono 4.084 risultati!!!!

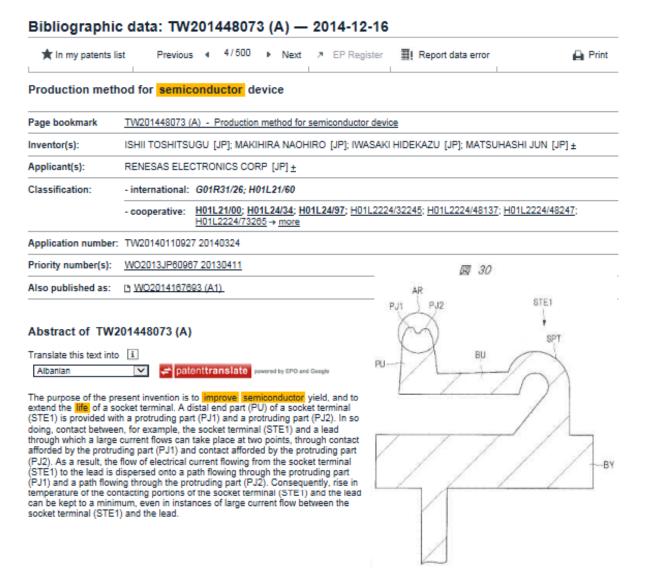
Res	sult list 🚨								
S	elect all (0/25)	Compact ⊖ Export (CSV XLS	) 🕹 Download	covers		Print			
IM	Approximately 4,084 results found in the Worldwide database for:  IMPROV* (LIF* OR DURATION*) SEMICONDUCT* in the title or abstract  Only the first 500 results are displayed.								
<b>1</b>	esults are sorted by date  PROCESS FOR TREATHE SEMICONDUCTO	ATING A <u>Semiconductor</u> -on-	INSULATOR STRU	CTURE FOR IMF	PROVING THICKNESS	UNIFORMITY			
*	Inventor: SCHWARZENBACH WALTER [FR] DURET CARINE [FR] (+1)	Applicant: SOITEC SILICON ON INSULATOR [FR]	CPC: H01L21/30604 H01L21/76251 H01L22/12 (+1)	IPC: H01L21/306 H01L21/66 H01L21/762	Publication info: US2015118764 (A1) 2015-04-30	Priority date: 2012-05-25			

N.B. Il data base consente la visualizzazione di soli 500 risultati.....





Limitatamente alla prima pagina di risultati, si possono estrarre i seguenti brevetti:



### Sintesi

Metodo per <u>aumentare</u> (*improve*) il rendimento di <u>semiconduttori</u> (*semiconductor*) ed estendere la <u>vita</u> (*life*) di un terminale di presa, dotando il terminale (STE1) di parti sporgenti (PJ1) e (PJ2).....come risultato, il flusso di corrente elettrica che fluisce dal terminale di presa (STE1) al piombo viene disperso attraverso le parti sporgenti (PJ1) e (PJ2)

### **SCHEMA DEL BREVETTO**

### Problemi affrontati:

aumentare il rendimento dei semiconduttori ed estendere la vita dei terminali di presa

**Soluzione**: dotare i terminali di sporgenze

### Risultati (effetto della soluzione):

il flusso di corrente viene deviato attraverso le sporgenze

### Bibliographic data: KR20140143563 (A) — 2014-12-17

n my patents lis	t Previous	4	5/500	Þ	Next	Global Dossier	≣!	Report data error	Print
DIAMOND ABRA	SIVE PAPER,	AN	D A ME	THO	OD OF	MANUFACTURIN	IG T	HE DIAMOND F	PAPER
Page bookmark	KR20140143563 PAPER	(A)	- DIAMOI	ND A	ABRASIN	/E PAPER, AND A ME	THOD	OF MANUFACTUR	RING THE DIAMOND
Inventor(s):	LEE SANG DON	[KR	] <u>+</u>						
Applicant(s):	INSUNG DIAMO	ND [	KR] <u>+</u>						
Classification:	- international: B24D3/10; B24D7/06; B24D9/00								
	- cooperative:								
Application number:	KR20130065256	201	30607						
Priority number(s):	KR20130065256	201	30607						

### Abstract of KR20140143563 (A)

Translate this text into	i		
Italian	~	⇒ patenttranslate	powered by EPO and Google

Provided are a manufacturing method of an abrasive diamond paper and the diamond paper, capable of precisely and easily abrading the surface of a flexible object or an object in a narrow space, comprising: a step of forming synthetic resin patterns protruding from the surface of a metal mesh; a step of electroplating metal material between the synthetic resin patterns on the metal mesh so that metal patterns with heights higher than the heights of the synthetic resin patterns are formed; and a bonding step of electroplating diamond particles on the upper surfaces of the metal patterns. Therefore, according to the present invention, a service life of the abrasive diamond paper can be secured to improve economic feasibility, and a flexible product such as a multi-layer PCB used for a semiconductor or an electric and electronic product can be abraded precisely and smoothly.

# tà

# PATLIB

### Sintesi

Metodo per produrre una carta abrasiva diamantata, in grado di abradere facilmente la superficie di oggetti flessibili, comprendente una fase di formazione di protuberanze resinose sintetiche......così facendo viene migliorata (improve) la vita (life) della carta abrasiva diamantata, che può essere ad esempio utilizzata per abradere con precisione la superficie di un semiconduttore (semiconductor)

### **SCHEMA DEL BREVETTO**

### **Problema affrontato:**

aumentare la vita di una carta abrasiva diamantata (che può essere usata per abradere semiconduttori)

**Soluzione**: formare delle protuberanze in resina sintetica sulla superficie della carta

### Risultati (effetto della soluzione):

Resa migliorata della carta





### Brevetto TW201448074:

la soluzione proposta consente di allungare la durata (vita) dei terminali di presa di un semiconduttore (non del semiconduttore in sé);

### Brevetto KR20140143563:

La soluzione proposta consente di migliorare la resa di una carta abrasiva diamantata

### E' evidente che:

- Il primo brevetto riguarda solo un particolare (terminali di presa) del problema proposto;
- Il secondo brevetto non è pertinente







### Bibliographic data: EP2858110 (A1) — 2015-04-08 n my patents list Previous 4 19 / 500 Next ■ EP Register Report data error Print POWER SEMICONDUCTOR DEVICE EP2858110 (A1) - POWER SEMICONDUCTOR DEVICE Page bookmark Inventor(s): OKAYAMA YOSHIO [JP] + Applicant(s): PANASONIC IP MAN CO LTD [JP] ± Classification: - international: H01L23/48: H01L25/07: H01L25/18: H02M7/48 - cooperative: H01L23/48; H01L23/49541; H01L23/49562; H01L23/49575; H01L23/49844; H01L23/50; H01L24/49; H01L25/07; H01L25/072; H01L2224/04042; H01L2224/06181; H01L2224/32225; H01L2224/32245; H01L2224/45014; H01L2224/45124; H01L2224/45144; H01L2224/45147; H01L2224/48227; H01L2224/48247; H01L2224/4903; H01L2224/49175; H01L2224/73265; H01L23/3107; H01L24/06; H01L24/32; H01L24/45; H01L24/48; H01L24/73; H01L25/18; H01L2924/1203; H01L2924/1305; H01L2924/13055; H01L2924/1306; H01L2924/13091; H01L2924/30101; H01L2924/30107; H02M1/088; H02M7/003 → more Application number: EP20130797797 20130409 Priority number(s): JP20120125833 20120601; WO2013JP02411 20130409 Also published as: <u>WO2013179547 (A1)</u> <u>CN104380462 (A)</u>

### Abstract of EP2858110 (A1)

Translate this text into	i		
Italian	~	→ patenttranslate	powered by EPO and Google

The present invention relates to a power semiconductor device, which performs power conversion by driving in parallel three or more power semiconductor elements, and the purpose of the present invention is to reduce variance of a voltage to be applied between the terminals of each of the power semiconductor elements, and to improve lifetime of the power semiconductor device. In order to achieve the purpose, in this power semiconductor elements (701-704) that are aligned and mounted on a metal wire (4), and another metal wire (5) different from the metal wire-(4), one terminal of each of the power semiconductor elements (5), the resistance value of the metal wire (4) in a region where the power semiconductor elements (701-704) are mounted is higher in the downstream side than that in the upstream side in the electric current flowing direction.

### Sintesi

Metodo per <u>aumentare</u> (*improve*) la <u>vita</u> (*lifetime*) di dispositivi <u>semiconduttori</u> (*semiconductors*), mettendo in parallelo tre o più elementi (semiconduttori), riducendo quindi la variazione di tensione ai capi di ciascun elemento.

### SCHEMA DEL BREVETTO

### Problema affrontato:

aumentare la vita di dispositivi semiconduttori

**Soluzione**: collegare in parallelo tre o più elementi

### Risultati (effetto della soluzione):

Riduzione degli sbalzi di tensione (con conseguente allungamento della vita dei semiconduttori)







### Brevetto **EP2858110**:

Il brevetto riguarda effettivamente una soluzione al problema proposto, ma:

- Non è immediatamente identificabile (attorno alla 250à posizione sull'elenco risultati);
- Non vi sono, tra le classificazioni relative a EP2858110 e ai due brevetti precedenti, diciture "esatte":

**H01L23/48** = Elettricità (H)  $\rightarrow$  elementi elettrici di base (H01)  $\rightarrow$  semiconduttori (H01L)  $\rightarrow$  dettagli di semiconduttori (H01L23)  $\rightarrow$  arrangiamenti per condurre corrente elettrica a o dal corpo solido quando operativo, ad es. cavi, terminali;

**H01L25/04** = Semiconduttori (H01L)  $\rightarrow$  assemblaggi consistenti in una pluralità di semiconduttori individuali (H01L25)  $\rightarrow$  detti semiconduttori non avendo contenitori separati (H01L25/04)







### Conclusioni

- 1) La ricerca delle soluzioni al problema proposto deve essere fatta "manualmente", per tentativi
- 2) Impossibile individuare tutte le soluzioni (max 500 Results)
- 3) Conseguenza: notevole perdita di tempo







# superamento dei limiti della ricerca brevettuale standard

Il servizio di Ricerca ad Alto Contenuto Tecnologico (A.C.T.) del Patlib

- 1) Cosa sono i motori di ricerca brevettuale semantica?
- 2) Come interrogare il data base?
- 3) Metodi e soluzioni: catalogazione dei risultati
- 4) Altre tipologie di indagine: la ricerca di mercato (brevettuale)
- 5) Altre tipologie di indagine: monitoraggio della concorrenza
- 6) I limiti del motore di ricerca







# 1) Cosa sono i motori di ricerca brevettuale semantica?

Sono motori di ricerca che riescono a distinguere, <u>inserendoli nel contesto specificato</u>, i termini (Keywords) impostati, che descrivono il problema tecnico affrontato sottoforma di domanda;

La ricerca viene effettuata nei principali data base brevetti, in decine di riviste scientifiche, in articoli di giornale e pubblicazioni

Consentono di effettuare ricerche brevettuali (standard), ricerche di PROBLEM SOLVING, ricerche di mercato (brevettuali) e monitoraggi (brevettuali) sofisticati sulle aziende concorrenti

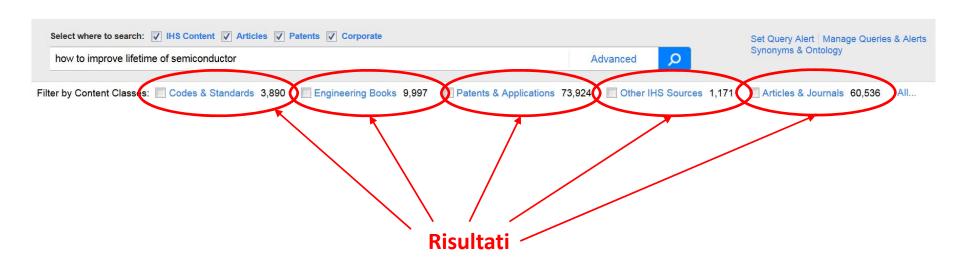




# 2) Come interrogare il data base?

Il problema deve essere poso sottoforma di domanda; nel caso dell'ESEMPIO 1 (*Ricercare sistemi / metodi che consentono di allungare la durata (vita) dei semiconduttori*) la domanda viene posta nel modo seguente:

### How to improve life of semiconductors?







3) Metodi e soluzioni: catalogazione dei risultati

Il motore di ricerca fornisce una serie di <u>soluzioni</u> (*methods*), disponibili in formato elenco:

Methods	9
drive method (12)	^
JP 窒化物半導体と格子整合するGaN基…(6)	
formation of semiconductor structure wi(4)	
repair of device through annealing proc (4)	
avoidance of increase of degrees in tem (2)	
containing of silicon oxide (2)	
containing of Mn oxide (2)	
doping of substrate interface region of s(2)	







Ciascuna di tali soluzioni contiene i link ai documenti (brevetti, articoli scientifici o altro)

che descrivono tale soluzione:

# Methods drive method (12) JP 窒化物半導体と格子整合するGaN基...(6) formation of semiconductor structure wi...(4) repair of device through annealing proc... (4) avoidance of increase of degrees in tem... (2) containing of silicon oxide (2) containing of Mn oxide (2) doping of substrate interface region of s...(2)

US-8445396 B2 Dielectric ceramic and laminated ceramic capacitor U.S. Granted Patents

containing of specific rare earth oxide

...ceramics containing a barium titanate based compound as their main constituent for the achievement of the object mentioned above, that the lifetime characteristics of the semiconductor ceramic can be improved by containing a specific rare earth oxide, a Mg oxide, a...

Save ▼ Summary 2 Similar Documents

US-5946242 Internal source voltage generator for a semiconductor memory device

U.S. Granted Patents

utilization of control path during normal mode and burn-in test mode

A circuit constructed in accordance with the present invention further improves the lifetime and operation of a semiconductor device by entering a... ...in test, and by utilizing separate control paths during a normal mode and a burn-in test mode.

Cliccando sul primo documento (brevetto US8445396):.....





....si accede al testo completo del brevetto, in cui le parti «rilevanti» (problema + soluzione), individuate <u>semanticamente</u>, vengono evidenziate in modo da facilitarne la comprensione

The present invention has been made in view of these circumstances, and an object of the present invention is to provide a dielectric ceramic which can achieve favorable reliability, and a laminated ceramic capacitor using the dielectric ceramic, which is suitable for intermediate to high voltage applications, even when dielectric layers are reduced in thickness.

The present inventors have found, through earnest research on semiconductor ceramics containing a barium titanate based compound as their main constituent for the achievement of the object mentioned above, that the lifetime characteristics of the semiconductor ceramic can be improved by containing a specific rare earth oxide, a Mg oxide, a Mn oxide, and a silicon oxide in predetermined amounts, additionally separating crystal grains into larger grains of 0.7 µm or more in grain size and smaller grains of 0.6 µm or less in grain size to define the respective average grain sizes for the larger and smaller grains and the ratio between the average grain sizes, further defining the area ratios (the area of the dielectric occupied expressed as a fraction) in the semiconductor ceramic for the larger and smaller grains, and thus, a semiconductor ceramic can be achieved which has more favorable reliability even when dielectric layers are reduced in thickness. In addition, it has been also determined that a similar effect is also produced when some of the Ti is substituted with a predetermined amount of Zr.

The present invention has been made based on this finding, and a dielectric ceramic according to the present invention contains a composition represented by {100(BaTiO3+aBaZrO3)+bR+cMg+dMn+eSi}, where R represents one or more elements selected from the group of Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, and Ho, wherein a, b, c, d, and e respectively satisfy 0≤a≤0.2, 8.0≤b≤12.0, 1.0≤c≤10.0, 0.1≤d≤3.0, and 1.0≤e≤10.0, and includes first grains A of 0.7 µm or more in grain size and second grains B of 0.6 µm or less in grain size, wherein the average grain size (Aave) for the first grains A and a average grain size (Bave) for the second grains B respectively satisfy 0.8 µm≤Aave≤2.0 µm and 0.1 µm≤Bave≤0.5 µm, the ratio Aave/Bave between the average grain size Aave and the average grain size Bave satisfies Aave/Bave≥3.0, and the area ratio (SA) occupied by the first grains and a area ratio (SB) occupied by the second grains satisfy 0.3≤SA≤0.9, 0.1≤SB≤0.7, and 0.8≤SA+SB≤1.0.

Si possono quindi riassumere il metodo e la relativa soluzione come segue:





### Riassunto della soluzione:

METODO: metodo di guida

DESCRIZIONE: ....le caratteristiche di durata del semiconduttore ceramico possono essere aumentate inserendo (nel semiconduttore) uno specifico ossido di terra rara, ad es. un ossido di Magnesio, un ossido di Manganese, ed un ossido di silicio in predeterminate quantità......

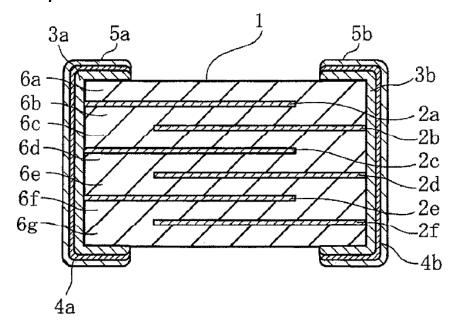
### **DOCUMENTO DI RIFERIMENTO:**

US8445396

**Titolo**: Dielectric ceramic and laminated ceramic capacitator

### (57) ABSTRACT

A laminated ceramic capacitor suitable for intermediate to high voltage applications uses a dielectric ceramic represented by  $\{100(BaTiO_3+aBaZrO_3)+bR+cMg+dMn+eSi\}$  where R is a rare earth element;  $0 \le a \le 0.2$ ,  $8.0 \le b \le 12.0$ ,  $1.0 \le c \le 10.0$ ,  $0.1 \le d \le 3.0$ , and  $1.0 \le e \le 10.0$ , and includes first grains of 0.7  $\mu m$  or more in grain size and an average first grain size (Aave) and area ratio of the ceramic (SA), and second grains of 0.6  $\mu m$  or less in grain size and an average second grain size (Bave) and area ratio (SB), 0.8  $\mu m \le Aave \le 2.0$   $\mu m$ , 0.1  $\mu m \le Bave \le 0.5$   $\mu m$ ,  $Aave/Bave \ge 3.0$ ,  $0.3 \le SA \le 0.9$ ,  $0.1 \le SB \le 0.7$ , and  $0.8 \le SA + SB \le 1.0$ .



Si possono riassumere i metodi (soluzioni) trovati nella seguente tabella:

Query: Come migliorare la vita dei semiconduttori?

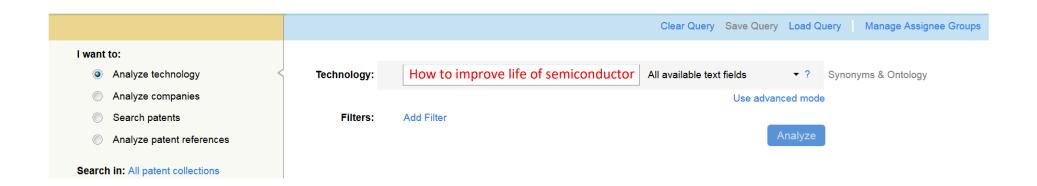
METODO	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	BREVE DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Metodo di guida: inserimento nel semiconduttore di un ossido di terra rara	US8445396 (A)  Brevetto per invenzione statunitense	Le caratteristiche di durata del semiconduttore ceramico possono essere aumentate inserendo (nel semiconduttore) uno specifico ossido di terra rara, ad es. un ossido di Magnesio, un ossido di Manganese, ed un ossido di silicio in predeterminate quantità
Migrazione di metallo da uno strato di barriera del semiconduttore	US768738 (B2)  Brevetto per invenzione statunitense	La migrazione di (atomi di) metallo da strati di barriera esterna verso l'interno del semiconduttore, <mark>migliora la resistenza alle alte temperature del semiconduttore, e</mark> quindi la durata dello stesso
Annealing (ricottura termica) di semiconduttori di riciclo ad un determinato intervallo di temperature	US7749869 (B2)  Brevetto per invenzione statunitense	La ricottura termica (annealing) dei semiconduttori rottamati avviene tra 1.200°C e 1.375°C, in un ambiente gassoso ricco di ossigeno; in tal modo gli agenti contaminanti evaporano, allungando la vita del semiconduttore
Sottoposizione di uno strato (isolante)	CERAMIC ABSTRACTS Article first published online: 27 NOV 2006 DOI: 10.1111/j.1151- 2916.1971.tb12256.x	La stabilità e la durata di un corpo semiconduttore ricoperto da uno strato isolante vengono migliorate sottoponendo lo strato, durante il riscaldamento, ad un'atmosfera comprendente HCl, in modo da creare un gradiente (di temperatura) che elimina, per diffusione esterna, alcuni materiali deleteri





4) Altre tipologie di ricerca: la ricerca di mercato (brevettuale)

Consente di effettuare indagini ed elaborazioni statistiche avanzate circa i depositi brevettuali effettuati in un determinato settore commerciologico, consentendo di indirizzare al meglio gli sforzi dei reparti R&D di un'azienda



E' possibile inserire la stessa query dell'esempio:





Si accede alle seguenti schermate:

Overview: Andamento dei depositi dal 1970 in poi

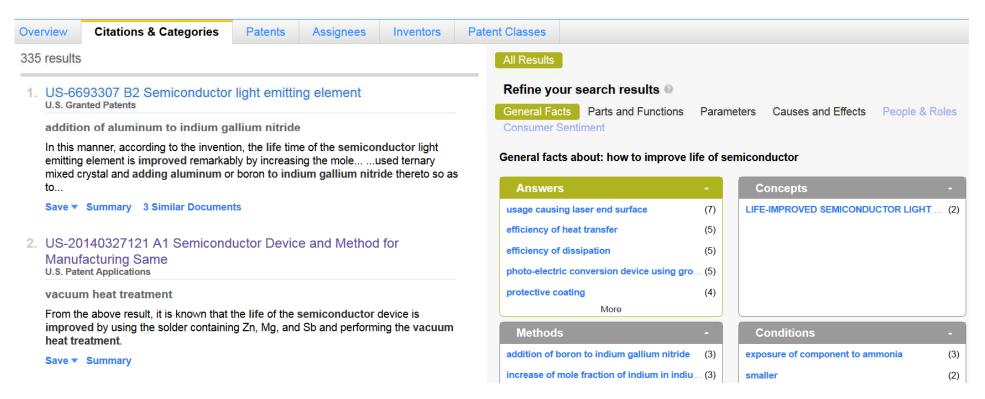
003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	19	18	25	15	22	13	22	10	18	19	16	4
Overview	Citatio	ons & Categories	Patents	Assignees	Inventors	Patent CI	asses					
					Patents Ac	tivity (335	patents found	d)				Save
30												
25												
Ø												
ication 20												
Ignd 15									$\vdash$			
Number of publications										ШП		
≥ 10												
5												
				_				- 1				
			1980	1985	1990		1995	2000	2005	20		2015

Citations & categories: i depositi brevettuali vengono suddivisi in diverse sezioni:

Answers (efficienza di dissipazione, rivestimento protettivo, ecc.);

Concepts (durata migliorata dei semiconduttori);

Methods (aggiunta di boro al nitrato di Gallio – Indio)









Patents: Elenco completo dei brevetti emersi

Overview	Citations & Categories	Patents Assignees	Inventors Patent Classes	
Save ▼ Cu	ustomize Columns			335 patents found
Tools	Publication Number	Publication Date	Title	Assignee
▼ Tools ▼	US-8987895 B2	24-Mar-15	Clad material for insulating substrates	Showa Denko Kabushiki Kaisha (Japan, Tokyo); Keating & amp Bennett, LLP (Japan, Tokyo)
▼ Tools ▼	DE-102014113215 A1	19-Mar-15	HALBLEITERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR AUSBILDUNG EINER HALBLEITERVORRICHTUNG	Infineon Technology AG (Germany(3), Neubiberg); 2 SPL Patentanwälte PartG mbB Schuler Schacht Platzer Lehmann (Germany(3), Neubiberg)
✓ Tools ▼	US-20150076650 A1	19-Mar-15	Semiconductor Device and a Method for Forming a Semiconductor Device	Infineon Technology AG (Germany, Neubiberg)
▼ Tools ▼	US-20150026449 A1	22-Jan-15	METHOD OF MANAGING A SOLID STATE DRIVE, ASSOCIATED SYSTEMS AND IMPLEMENTATIONS	SamSung Electronic Co. Ltd. (Republic of Korea, Suwon-si)
▼ Tools ▼	US-8912644 B2	16-Dec-14	Semiconductor device and method for manufacturing same	Hitachi, Ltd. (Japan, Tokyo); Volpe and Koenig, PC (Japan, Tokyo)
▼ Tools ▼	US-8904088 B2	02-Dec-14	Method of managing a solid state drive, associated systems and implementations	SamSung Electronic Co. Ltd. (Republic of Korea, Gyeonggi-do); HARNESS, DICKEY & amp PIERCE, plc (Republic of Korea, Gyeonggi-do)





Assignees: Suddivisione dei brevetti per Richiedente e per numero di depositi, con indicazione del trend di crescita (Up / Down)









N.B.: è possibile mettere a confronto i depositi brevettuali delle aziende elencate (ad esempio le prime 5)

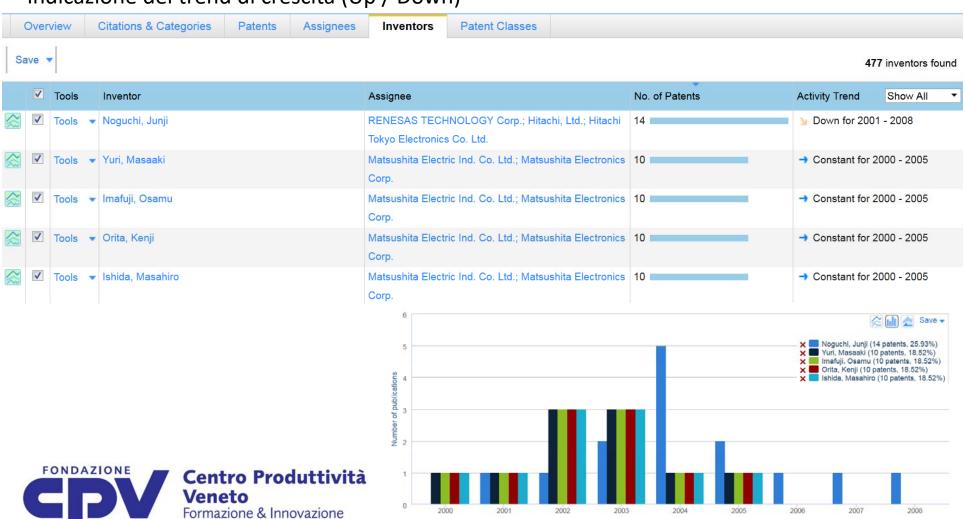
✓ Tools ▼ Hitachi, Ltd. 16 ■ Up for 1976   ✓ Tools ▼ Sharp Kabushiki Kaisha 13 ■ Down for 1   ✓ Tools ▼ Sanyo Electric Co. Ltd. 11 ■ Up for 200   ✓ Tools ▼ Sony Corp. 11 ■ Up for 1996   ✓ Tools ▼ Matsushita Electric Ind. Co. Ltd. 11 ■ Hitachi, Ltd. (16 patents Sharp Kabushiki Kaishe 20.97%)   X ■ Hitachi, Ltd. (16 patents Sharp Kabushiki Kaishe 20.97%) X ■ Sanyo Electric Co. Ltd.   3 ■ Annual Co. Ltd. 17.74%)   X ■ Sony Corp. (11 patents Sharp Kabushiki Kaishe 20.97%) X ■ Sony Corp. (11 patents Sharp Kabushiki Kaishe 20.97%)	<u> </u>	Tools	As	ssignee	No. of Patents	Activity Trend	Shov
Tools Sharp Kabushiki Kaisha  Sanyo Electric Co. Ltd.  Tools Sony Corp.  Tools Matsushita Electric Ind. Co. Ltd.  Hitachi, Ltd. (16 patents 20.97%)  Sanyo Electric Co. Ltd.  Hitachi, Ltd. (16 patents 20.97%)  Sanyo Electric Co. Ltd.  Wassushita Electric Ind. Co. Ltd.  Hitachi, Ltd. (16 patents 20.97%)  Sanyo Electric Co. Ltd.  Sharp Kabushiki Kaisha 20.97%)  Sanyo Corp.  Matsushita Electric Ind. Co. Ltd.	<b>/</b> T	Tools	▼ Pa	atents assigned to an individual or to no assignee	49	→ Up for 1980 -	2012
V Tools ▼ Sanyo Electric Co. Ltd.  V Tools ▼ Sony Corp.  V Tools ▼ Matsushita Electric Ind. Co. Ltd.  W Hitachi, Ltd. (16 patents Sharp Kabushiki Kaisha 20.97%)  Sanyo Eletric Co. Ltd.  W Hitachi, Ltd. (16 patents Sharp Kabushiki Kaisha 20.97%)  Sony Corp. (11 patents X Matsushita Electric Ind. patents, 17.74%)	<b>V</b> T	Tools	▼ Hi	litachi, Ltd.	16	Up for 1978 -	2014
Tools ▼ Sony Corp.  Tools ▼ Matsushita Electric Ind. Co. Ltd.   **Independent of the patents of	<b>V</b>	Tools	▼ Sh	harp Kabushiki Kaisha	13	> Down for 198	6 - 200
▼ Tools ▼ Matsushita Electric Ind. Co. Ltd.  X ■ Hitachi, Ltd. (16 patents x ■ Sharp Kabushiki Kaisha 20.97%)  X ■ Sanyo Electric Co. Ltd. 17.74%)  X ■ Sony Corp. (11 patents x ■ Matsushita Electric Ind.	<b>V</b>	Tools	▼ Sa	anyo Electric Co. Ltd.	11	Up for 2001 -	2012
X ■ Hitachi, Ltd. (16 patents X ■ Sharp Kabushiki Kaisha 20.97%) X ■ Sanyo Electric Co. Ltd. 17.74%) X ■ Sony Corp. (11 patents X ■ Matsushita Electric Ind.	<b>V</b>	Tools	▼ Sc	Sony Corp.	11	Up for 1996 -	2009
X ■ Sharp Kabushiki Kaisha 20.97%) X ■ Sanyo Electric Co. Ltd. 17.74%) X ■ Sony Corp. (11 patents X ■ Matsushita Electric Ind.	<b>V</b> T	Tools	▼ Ma	fatsushita Electric Ind. Co. Ltd.	11	Up for 1987 -	2006
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010					1	<ul> <li>Sanyo Électric Co. Ltd. (11 17.74%)</li> <li>Sony Corp. (11 patents, 17</li> <li>Matsushita Electric Ind. Co</li> </ul>	7.74%)



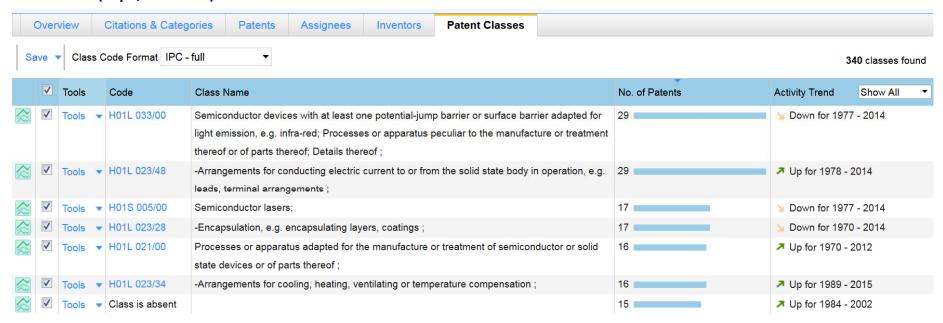




Inventors: Suddivisione dei brevetti per Inventore e per numero di depositi, con indicazione del trend di crescita (Up / Down)



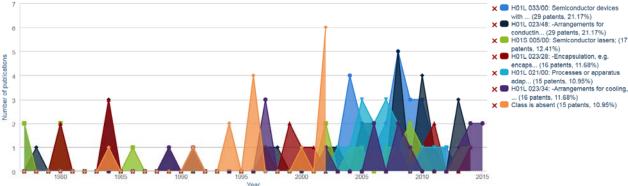
Patent classes: Suddivisione dei brevetti per classe IPC, con indicazione del trend di crescita (Up / Down)





**FONDAZIONE** 

Veneto



🙈 📊 🦣 Save 🕶

# 5) Altre tipologie di ricerca: Monitoraggio della concorrenza

Consente di mettere a confronto i depositi brevettuali delle aziende concorrenti, con relativi trend di crescita / decrescita

Si possono ad esempio inserire le aziende – *Top Assignees* emerse dalla ricerca precedente:

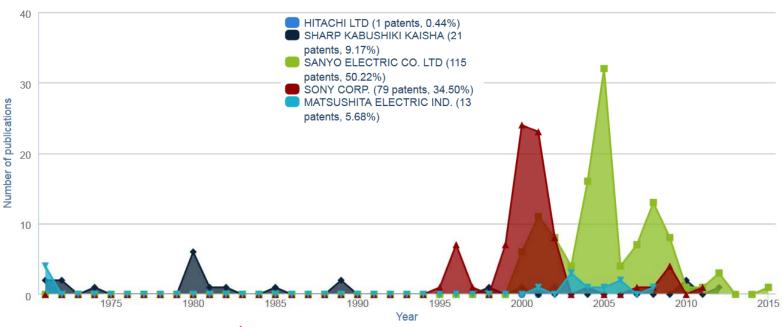
Company 1:		HITACHI LTD <temp_group></temp_group>	Assignee
Company 2:	$\times$	SHARP KABUSHIKI KAISHA <temp_group></temp_group>	Assignee
Company 3:	$\times$	SANYO ELECTRIC CO. LTD <temp_group></temp_group>	Assignee
Company 4:	$\times$	SONY CORP. <temp_group></temp_group>	Assignee
Company 5:	$\times$	MATSUSHITA ELECTRIC IND. <temp_group></temp_group>	Assignee





# La ricerca brevettuale semantica: monitoraggio concorrenti

E ricavare così dati utili quali la comparazione tra i depositi:



Con i relativi trend di crescita / decrescita:

Table Name Assignees

Assignee	No. of Patents	Activity Trend
SANYO ELECTRIC	115	Down for 2000 - 2015
CO. LTD		
<temp_group></temp_group>		
SONY CORP.	79	Down for 1995 - 2011
<temp_group></temp_group>		
SHARP	21	Down for 1971 - 2012
KABUSHIKI		
KAISHA		
<temp_group></temp_group>		
MATSUSHITA	13	Down for 1971 - 2008
ELECTRIC IND.		
<temp_group></temp_group>		
HITACHI LTD	1	Low activity
<temp_group></temp_group>		



### **ESEMPIO 2**

### Ricercare sistemi / metodi che consentono di migliorare il rendimento di motori elettrici

### **Query:** How to improve performance of electric engines?

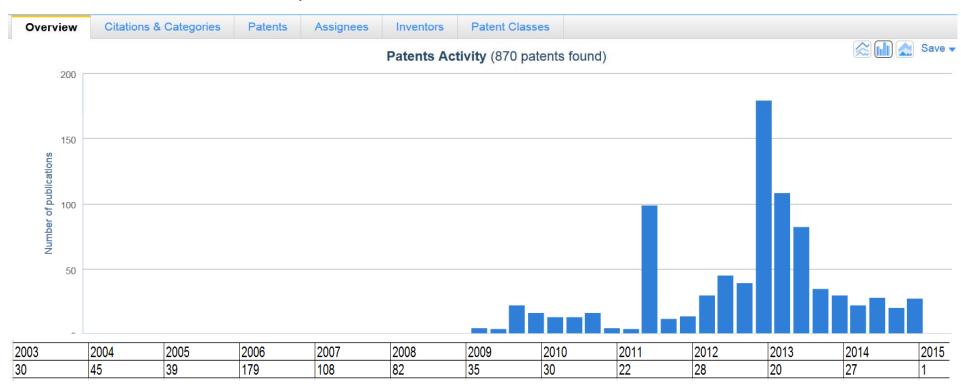
### 1) RICERCA DELLE SOLUZIONI: Risultati

METODO	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	BREVE DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Espansione polare di statore a mezzo passo	FR2835362 (A1) Brevetto per invenzione francese	Metodo per migliorare la prestazione di un motore elettrico, consistente nell'invertire la polarità dei magneti permanenti frazionati per separazione, in modo da ottenere quattro magneti di polarità alternate descrivendo una spira
Disposizione del motore elettrico sul lato del freno adisco	FR2829434 (B1) Brevetto per invenzione francese	Disponendo il motore elettrico e il freno a disco sullo stesso lato della ruota, si possono migliorare le prestazioni di montaggio del motore elettrico e del meccanismo frenante sulla ruota, e le prestazioni del motore elettrico
Rotazione del motore elettrico	DE112010005824 (T5)  Brevetto per invenzione francese	Quando la temperature del motore elettrico supera un valore prefissato, il motore stesso viene messo in rotazione in modo tale da interrompere l'accoppiamento.
Agire sull'elica di raffreddamento	FR2983432 (A1)  Brevetto per invenzione francese	Il trovato intende ovviare a questi inconvenienti della tecnica nota fornendo un'elica migliorata, al fine di migliorare la ventilazione e le prestazioni del motore di azionamento elettrico.
Studio dettagliato di un micro motore termico per la raccolta di energia termica	IOP Articles (ioumal of micromechanics and microengineering – T Huesgen et al 2010 J. Micromech Microeng. 20 104004 doi: 10.1088/0960-1317/20/10/104004)	Questo articolo presenta un motore termico micro fabbricato in micro silicone. Il suo principio di funzionamento si basa su una cavità riempita di un fluido di lavoro liquido-gas-cambiamento di fase che esegue un movimento alternativo autocontrollato entro una sorgente di calore ed un dissipatore di calore i lavori futuri si concentrano su come ottimizzare le prestazioni del motore e l'integrazione di un generatore meccano-elettrico.



### 2) RICERCA DI MERCATO BREVETTUALE Overview

E' possibile inserire, come filtro di ricerca, <u>le sole classificazioni IPC</u> (*ricerca di Stato dell'Arte*), ad esempio la classe B60K06/00 (*sistemi di propulsione ibrida comprendenti motori a combustione e motori elettrici*)



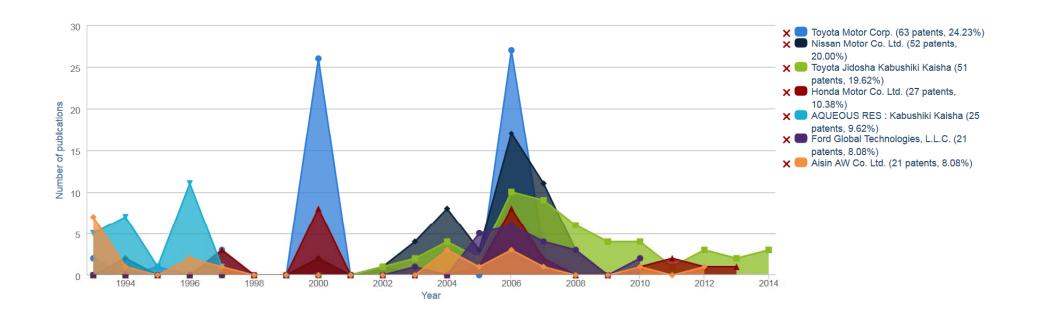






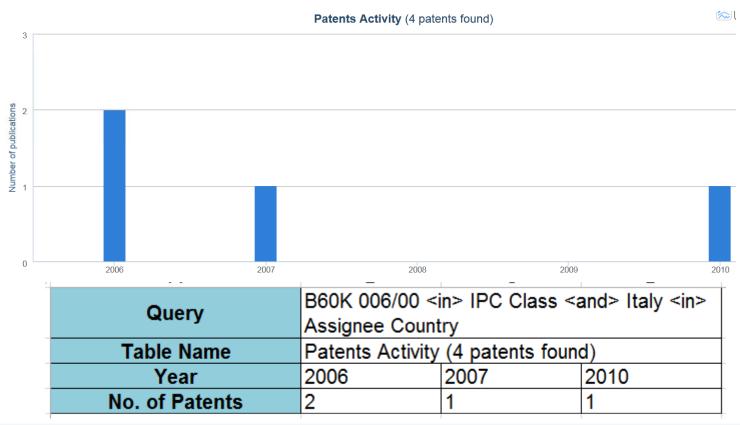
## 2) RICERCA DI MERCATO BREVETTUALE Assignees

S	Save   Z43 assignees found				
	<b>V</b>	Tools	Assignee	No. of Patents	Activity Trend Show All ▼
8	<b>V</b>	Tools •	Patents assigned to an individual or to no assignee	229	→ Up for 1991 - 2014
~	<b>V</b>	Tools •	Toyota Motor Corp.	63	Up for 1993 - 2007
	<b>V</b>	Tools	Nissan Motor Co. Ltd.	52	→ Up for 1994 - 2010
	<b>V</b>	Tools •	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha	51	> Down for 2002 - 2014
$\approx$	<b>✓</b>	Tools •	Honda Motor Co. Ltd.	27	> Down for 1997 - 2013
	<b>V</b>	Tools •	AQUEOUS RES : Kabushiki Kaisha	25	> Down for 1993 - 1997
$\approx$	<b>V</b>	Tools •	Ford Global Technologies, L.L.C.	21 🚾	> Down for 2003 - 2010
	<b>√</b>	Tools •	Aisin AW Co. Ltd.	21 📉	> Down for 1993 - 2012



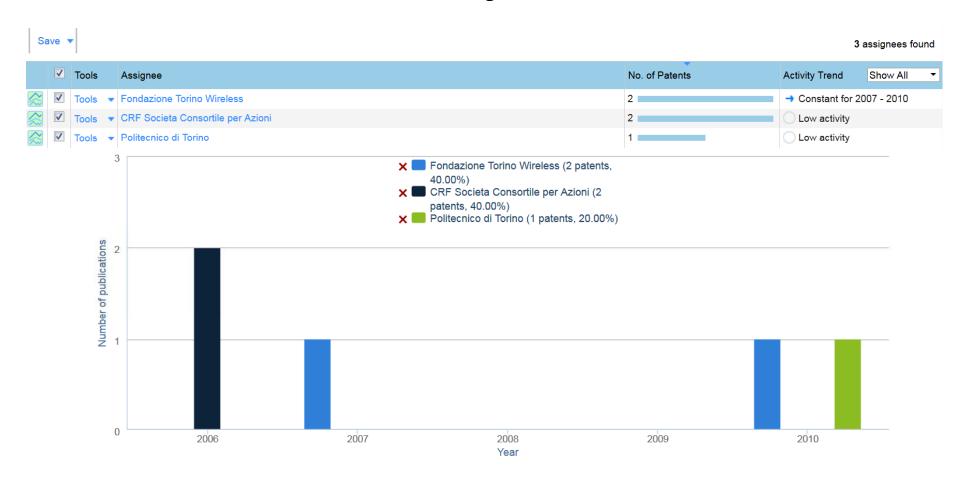
### 2a) RICERCA DI MERCATO BREVETTUALE Overview

E' possibile aggiungere al filtro B60K06/00 (sistemi di propulsione ibrida comprendenti motori a combustione e motori elettrici) il filtro «assegnee Country = Italy», ottenendo:



**N.B.** il motore di ricerca non contiene i brevetti italiani (solo EP o WO depositati a nome di cittadini italiani)

### 2a) RICERCA DI MERCATO BREVETTUALE Assignees









Compilando l'apposito modulo di incarico di ricerca A.C.T. (*scaricabile al sito* <u>www.cpv.org</u> o da richiedere per mal a <u>brevettiemarchi@cpv.org</u>):

Parte anagrafica

# INCARICO DI RICERCA A.C.T. (ad Alto Contenuto Tecnologico) Commissionario:

Fondazione Centro Produttività del Veneto (CPV)
Sede legale e Sede operativa: via Eugenio Montale 27, 36100 Vicenza
Tel 0444/994700, fax 0444/994710, e-mail brevettiemarchi@cpv.org, web www.cpv.org

### **Dati Richiedente**

Nome e Cognome				
Nato a		il		
Residente a	Prov.	CAP		
Via		n.		
Telefono	Fax			
Partita Iva				
Codice Fiscale				
e-mail	Web			
Cellulare (facoltativo)				

### Dati intestazione fattura

da compilare se diversi da quelli del partecipante

Ragione sociale	
Città	
Prov.	CAP
Via	n.
Telefono	Fax
Partita Iva	
Codice Fiscale	
e-mail	
Sito web	







Selezione della tipologia di ricerca richiesta: ricerca tipologia «a»

### Con la presente vi incarichiamo di svolgere la seguente tipologia di ricerca:

a) Ricerca di soluzioni a problemi di natura tecnica

(Specificare di seguito la natura del problema tecnico-ingegneristico)

- 1 come aumentare la durata di vita di dispositivi semiconduttori?
- <sup>2</sup> come migliorare la sicurezza dei bambini nelle automobili?
- <sup>3</sup> come ridurre i tempi di risposta di un fusibile per impianti domestici?

### ESITI:

Report in formato lettera contenente lo schema riassuntivo degli esiti delle ricerche di Problem solving: METODO (Titolo) – DOCUMENTO DI RIFERIMENTO – DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Specifiche delle soluzioni trovate (sintesi in italiano dei documenti di riferimento)





- Selezione della tipologia di ricerca richiesta: ricerca tipologia «b»
- □ b) Ricerca di mercato brevettuale sul settore commerciologico di seguito descritto (+ monitoraggio aziende):

(Specificare di seguito il settore di interesse)

- 1 Abbigliamento anti-infortunistico
- <sup>2</sup> Crescita epitassiale di dispositivi semi-conduttori
- <sup>3</sup> Antifurti domestici

### ESITI:

Report in formato lettera contenente:

- il trend generale di deposito (andamento dei depositi brevettuali suddivisi per anno, con distribuzione statistica degli stessi
- il trend di deposito per titolare (lista dei principali depositanti con relativi trend di deposito; crescente, decrescente, stabile
- Comparazione (monitoraggio) tra le 10 aziende leader di settore, con link ipertestuali ai relativi depositi brevettuali





- Selezione della tipologia di ricerca richiesta: ricerca tipologia «c»
- □ c) Monitoraggio brevettuale delle seguenti aziende:

(inserire fino ad un massimo di 10 aziende, specificando per ognuna, se nota, la città di residenza)

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

### **ESITI:**

si esegue sostanzialmente la terza parte della tipologia di ricerca b (comparazione tra 10 aziende); le aziende, in questo caso, vengono direttamente indicate dal Richiedente la Ricerca







### Modulo di incarico di ricerca A.C.T.: seconda pagina

Urgenza (a discrezione di CPV ):	<ul> <li>24 ore lavorative (supplemento : +200% totale)</li> <li>48 ore lavorative (supplemento : +150% totale)</li> <li>5 giorni lavorativi (supplemento : +100% totale)</li> </ul>
Consegna del materiale :	<ul> <li>di persona al richiedente o delegati</li> <li>per posta (previo avviso di effettuato pagamento, come da condizioni allegate, e con addebito delle spese postali)</li> </ul>

### TARIFFARIO RICERCA BREVETTUALE (IVA NON COMPRESA)

SERVIZI FORNITI: DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	SERVIZI FORNITI: DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO
Ricerca di soluzioni a problemi di natura tecnica (tipologia di ricerca "a")		Monitoraggio brevettuale (tipologia di ricerca "c")	
Ricerca di mercato (tipologia di ricerca "b")		Pacchetto ricerca "a" + ricerca "b"	

E' possibile selezionare il «pacchetto ricerca a + b»





NON E' una sfera di cristallo!!!!!









Le query da inserire non devono essere troppo lunghe; ad es:

«Quali sono i sistemi di smaltimento dei rifiuti che consentano di compattare gli scarti industriali nel minor tempo e con il minor costo possibili:»

Deve essere semplificata in questo do

«Come compattare i rifiuti

costo) possibile?»







Il problema deve essere reale; ad es:

«Come aumentare il rengimentare di autori della CURVATURA?»

(Soluzione: chiedere al Sig. Scott della nave stellare ENTERPRISE)









La query non deve già contenere la soluzione; ad es:

«Come aumentare la durata (vita) or la sistema di semiconduttori collegati in parallelo?

La soluzione ad un determinato problema non è presente in quanto non è ancora stata inventata!!!!........

...tentare quindi di trovare la soluzione con altri metodi

# TRIZ







# Grazie per l'attenzione

### **Giorgio Meneghin**

Fondazione – Centro Produttività Veneto

Via E. Montale 27, 36100 Vicenza IT

Tel +39 0444 994700 / 706

Fax +39 0444 994710

meneghin@cpv.org

brevettiemarchi@cpv.org

info@cpv.org





